

## テクトロニクス、100G 光規格のテスト・サポートを

### OFC/NFOEC 2012 の展示会で発表

テスト機器メーカーとして唯一、高速光インターオペラビリティのデモンストレーションにも参加

[2012年2月27日 米国オレゴン州ビーバートン発]

テクトロニクスは、米国カリフォルニア州ロサンゼルス・コンベンション・センターで3月4～8日に開催される光通信・ネットワークの展示会である OFC/NFOEC (Optical Fiber Communication and Exposition / National Fiber Optic Engineers Conference) 2012 で、100G ITU、IEEE の光規格のテスト・サポートを展示することを発表しました。

OFC 2012 の展示会において、テクトロニクス(ブース番号:1239)は、光コンポーネント、トランシーバのサブアセンブリまたは伝送システムに従事されるエンジニアのための最新のテスト・ソリューションを展示します。この展示では、最新の[DPO73304D 型](#)、[DSA8300 型](#)オシロスコープ、[OM4000 シリーズ](#)光変調アナライザ、[BERTScope シリーズ](#)・ビットエラー・レート・アナライザを統合したソリューションをご覧ください。

テクトロニクスのブースでは、次のような光テストに関するデモを行います。

- ・ 240Gbaud までのコヒーレント光変調解析
- ・ 25G×4 のレシーバ・テストとパターン生成
- ・ 16G の Fibre Channel、IEEE 802.3ba 40/100GbE 規格の光コンプライアンス・テスト
- ・ [AWG7000 シリーズ](#)を使用した QAM、OFDM 信号生成のデモ

また、テクトロニクスは会期中、OIF (Optical Internetworking Forum) が主催する OIF Interoperability 2012 - Enabling High-Speed Dynamic Services と題する[デモンストレーション](#)に参加する唯一のテスト機器メーカーとなります。このデモを通じて、コンポーネント/テスト機器メーカーは、光業界のより高速なインタフェース、バックプレーンへの移行に対してサポートが可能であることを示します。

テクトロニクス、パフォーマンス・オシロスコープ、ジェネラル・マネージャのブライアン・ライク (Brian Reich) は、次のように述べています。「100G の技術、優れた光変調技術が現実のものになり、光通信が

実現しつつあります。OFC での展示で示すように、テクトロニクスはメトロ／基幹通信ネットワークに対する高速化、効率化という光業界のニーズに対し、最先端の優れたテスト・ソリューションでお応えします」

### **OIF のマルチベンダによるインターオペラビリティ・テストについて**

どの規格においても、インターオペラビリティは成功の鍵となります。CEI(Common Electrical Interface)の承認、実証のため、2012 年 1 月、OIF 主催による非公開のインターオペラビリティ・プラグフェストが実施されました。CEI の実装には業界内のさまざまな企業によるサポートがあり、半導体製造メーカ 5 社、コネクタ・ベンダ 3 社、光モジュール・ベンダ 3 社、テスト機器メーカ(テクトロニクス)が参加しています。システム・ベンダによるハイスピード・シグナリングの実装、統合には、半導体、コネクタ、光モジュール、テスト機器の各メーカ間の協力が欠かせません。OFC 2012 では、非公開のインターオペラビリティ・テストで行われたのと同様のテスト・シナリオにより、25G-LR と 28G-VSR の条項をデモします。PLL のインターオペラビリティ・テストで使用されるテクトロニクスの計測器は以下の通りです。

DSA8300 型サンプリング・オシロスコープ：モジュール型のオシロスコープ・プラットフォームであり、計測器自身のジッタ・フロアが 425fs rms と小さく、最大 8 チャンネルの信号を正確に取込むことができます。ジッタ測定アプリケーション・ソフトウェア 80SJARB を使用したアイ・ダイアグラムとジッタの解析により、IEEE 820.3ba の J2、J9 のジッタ測定に対応しています。また、DSA8300 型に 80C10B 型光サンプリング・モジュールを装備することにより、1 台のモジュールで 25.781Gbps(100GBASE-ER4、100GBASE-LR4)と 27.739Gbps(100GBASE-ER4 FEC、100GBASE-LR4 FEC)の適合性試験が行えます。

AWG7000 シリーズ：24GS/s の最高サンプル・レート、10 ビット垂直分解能を備えた任意波形ジェネレータであり、高速のパターン出力、クロック・リファレンス・ソースとして最適です。

OFC/NFOEC 2012 の展示会の詳細については、ウェブ・サイト([www.ofcnfoec.org](http://www.ofcnfoec.org))をご参照ください。

### **テクトロニクスについて**

テクトロニクスは、計測およびモニタリング機器メーカとして、世界の通信、コンピュータ、半導体、デジタル家電、放送、自動車業界向けに計測ソリューションを提供しています。65年以上にわたる信頼と実績に基づき、お客様が、世界規模の次世代通信技術や先端技術の開発、設計、構築、ならびに管理をより良く行えるよう支援しています。米国オレゴン州ビーバートンに本社を置くテクトロニクスは、現在世界 22カ国で事業を展開しています。詳しくはウェブサイト([www.tektronix.com/ja](http://www.tektronix.com/ja))をご覧ください。

**テクトロニクス®の最新情報はこちらから**

Twitter (@tektronix\_jp)

facebook (<http://www.facebook.com/tektronix.jp>)

YouTube (<http://www.youtube.com/user/TektronixJapan>)

**お客さまからのお問合せ先**

テクトロニクス お客様コールセンター

TEL 0120-441-046 FAX 0120-046-011

URL <http://www.tektronix.com/ja>

報道関係者からのお問い合わせ先:  
テクトロニクス 広報室 瀬戸  
電話:03(6714)3097 Fax:03(6714)3667  
email: [seto.atsuko@tektronix.com](mailto:seto.atsuko@tektronix.com)

Tektronix、テクトロニクスは、Tektronix, Inc.の登録商標です。本プレスリリースに記載されているその他すべての商標名および製品名は、各社のサービスマーク、商標、登録商標です。